

MN Technologies SAS es distribuidor oficial en Colombia de Zeiss, empresa que desarrolla y distribuye equipos de fabricación de semiconductores, tecnología de medición, microscopios, tecnología médica, prismáticos y tecnología para planetarios. La empresa surgió a partir de un taller de óptica y mecánica de precisión creado por su fundador Carl Zeiss en la ciudad de Jena, en el este de Alemania, en 1846. En la actualidad, la sede central de Carl Zeiss se encuentra en Oberkochen en el sudoeste de Alemania.



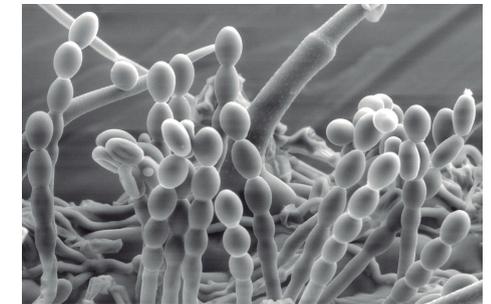
Los microscopios electrónicos de barrido (SEM) escanean una muestra con un haz de electrones enfocado y entregan imágenes con información sobre la topografía y la composición de las muestras. Los instrumentos de la Familia EVO combinan la microscopía electrónica de barrido de alto rendimiento (microscopios con fuentes de emisión termoiónica LaB6 y W) con una experiencia intuitiva y fácil de usar que atrae tanto a los microscopistas entrenados como a los nuevos usuarios. Con su amplia gama de opciones disponibles, EVO se puede adaptar a sus necesidades, ya sea en ciencias de la vida, ciencias de los materiales o análisis de fallas y aseguramiento de la calidad industrial de rutina.



“Toda la información que se muestra en una sola plataforma”

ZEISS EVO
FAMILY
Microscópio Electrónico

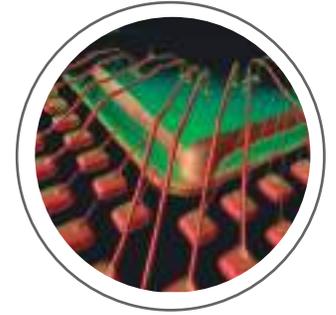
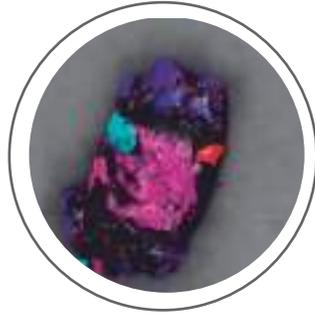
EVO CALIDAD



EVO se puede configurar para que se a parte de un flujo de trabajo multimodal integrando la información procedente de las diferentes técnicas de microscopía (óptima con focal, FIB-SEM, y microscopía rayos x).

EVO es excelente para extraer la máxima calidad de datos de muestras sin revestir y sin modificar. Genera análisis en muestras no conductoras sin recubrimiento y obtenga la mayor resolución con la gama de detectores y presiones EVO, con relación señal ruido.

Más de EVO
FAMILY
Conéctese con
otras soluciones



ZEISS

Microscopía
Correlativa



Microscopio Óptico

Correlación precisa con la resolución nanométrica. Combine su microscopio electrónico de barrido con un microscopio óptico: superponga sus imágenes de fluorescencia y ultra-resolución.

Microscopio FIB-SEM

Aplicaciones de nanotomografía y nanofabricación. Combinan la tecnología de imagen tridimensional y el rendimiento de análisis de la columna de haz de electrones de Gemini con la capacidad de un haz de iones para el procesamiento del material.



Microscopio XRM (Rayos X)

Ofrece imágenes tridimensionales no destructivas con las mejores capacidades de resolución, contraste e in situ de la industria, permite lograr una investigación pionera para la más amplia gama de tamaños de muestra.

100 nm
|-----|

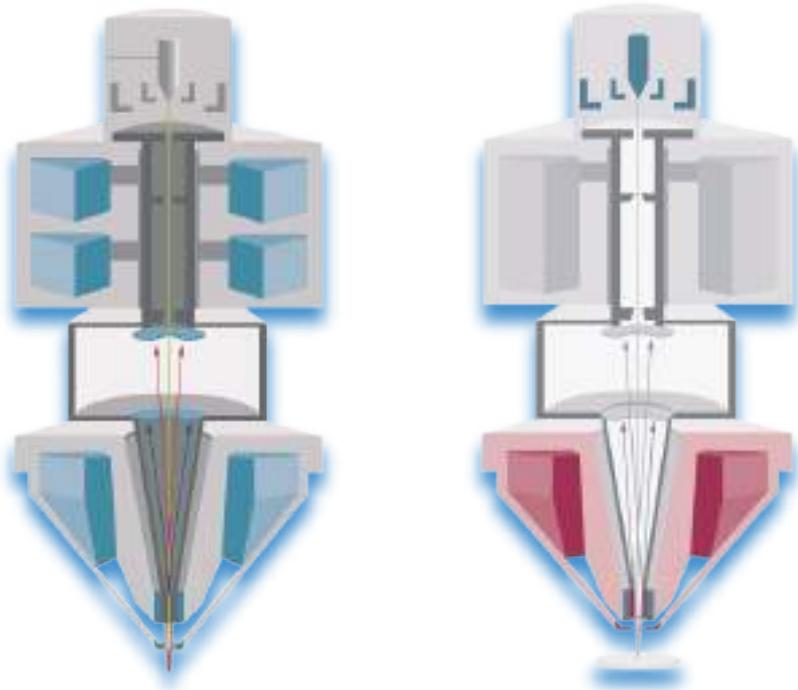


ZEISS GEMINI SEM

Microscopio Field Emission

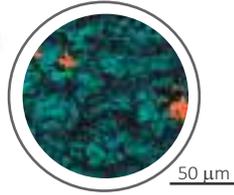


La familia GeminiSEM es sinónimo de imágenes sin esfuerzo con resolución **subnanométrica (NanoVP)** y alta eficiencia de detección, incluso en modo de presión variable para su investigación en ciencias de materiales o ciencias de la vida, laboratorio industrial o instalaciones de imágenes. Utilice los detectores de mayor resolución, incluso en bajo vacío a 1.7nm a 3kV y 30Pa.



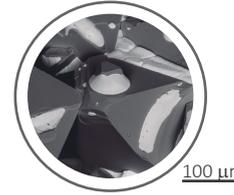
Más de ZEISS
GEMINI SEM

Para la investigación científica y de rutina



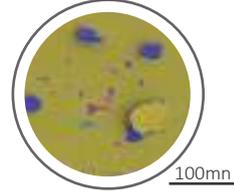
GeminiSEM 360

Más señal y detalles a muy bajos voltajes para cualquier muestra. Imágenes nítidas y con un mínimo daño a la muestra, gracias a la señal de detección de InLens.



GeminiSEM 460

Su especialista en velocidad y sensibilidad superficial en imágenes y análisis. Logre mayor resolución espacial. Alta corriente y alta resolución.



GeminiSEM 560

Observe sus muestras no conductoras en bajo vacío sin sacrificar resolución, gracias a la tecnología NanoVP.

ZEISS

Gemini SEM Field Emission

(FE-SEM)

GeminiSEM 500

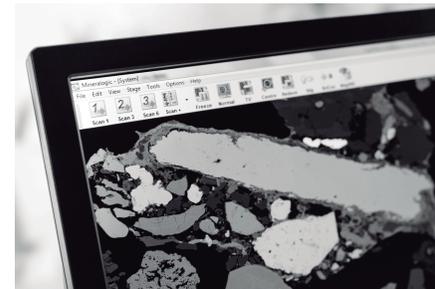


100 nm

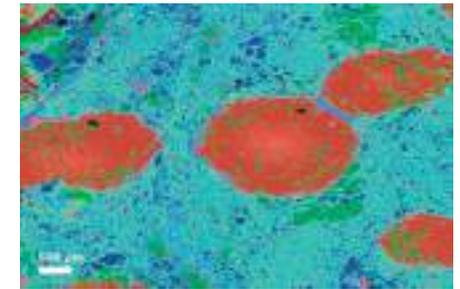
ZEISS MINERALOGIC MINING

Microscopio Robusto Grado Militar para Minería

Caracterice los minerales y logre la máxima recuperación de recursos. Con **Mineralogic Mining**, utilice el análisis de minerales automatizado para identificar y cuantificar minerales en tiempo real, bien sea en el laboratorio o directamente en la mina; combine un microscopio electrónico de barrido con uno o más detectores EDS, un motor de análisis mineral y el complemento de software Mining. Proporcionamos productos específicos de la industria para mejorar los procesos de extracción y brindar a los operadores una ventaja en la recuperación.



MINERALOGIC CONTROL



MINERALOGIC ANÁLISIS

Caracteriza fácilmente y con rapidez nuevos cuerpos de mineral usando EDS cuantitativo, crea bibliotecas de minerales para clasificar yacimientos de minerales desconocidos, reduce significativamente la necesidad de usar datos de XRD o microsonda.

Analiza cuantitativamente a lo largo del proceso de exploración, recuperación y control los tipos de mineral en función de las características químicas y texturales, procesa minerales de bloques de minas, valora, caracteriza y mapea el mineral, entre otras características.

ZEISS MINERALOGIC MINING

Analizador Petrológico Cuantitativo Automatizado



Utilice diferentes tipos de opciones de
CLASIFICACIÓN PARA CARACTERIZAR SU MINERAL

Niveles de Gris Ratio de Elementos Morfología



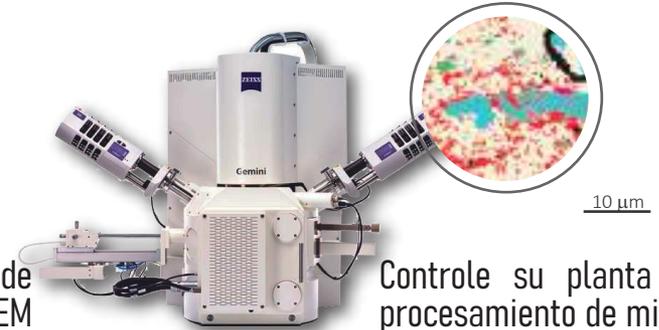
Permite la adquisición automatizada y sin supervisión de imágenes en lotes de muestra, permite al usuario definir una región límite, generar automáticamente regiones de interés determinadas por el campo de visión o aumento requerido.

Zeiss EVO
Control de Proceso de Mineral



Combine la tecnología de emisión de campo SEM (FE-SEM) con análisis avanzado, crea imágenes de partículas, superficies y nanoestructuras, reconoce información molecular y cristalográfica, y realice análisis 3D.

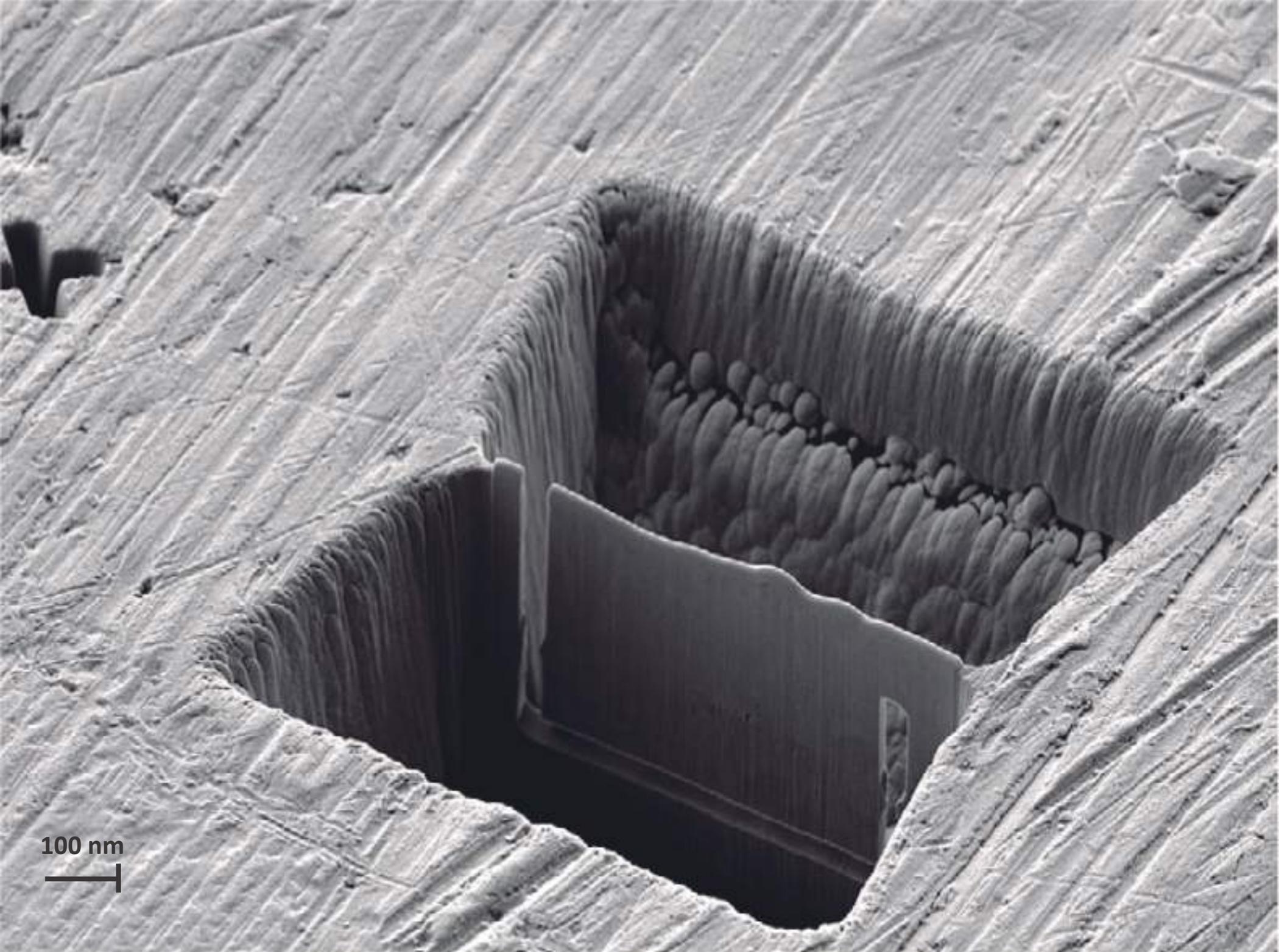
Zeiss SIGMA
Investigación Proceso de Mineral



Controle su planta de procesamiento de minerales a través del análisis mineralógico diario de las corrientes de proceso. Comprensión integral del rendimiento diario de plantas de gas, petróleo y minería.

Zeiss Hardware SEM
Ruggedized de
MinSCAN Entornos





100 nm

ZEISS CROSSBEAM

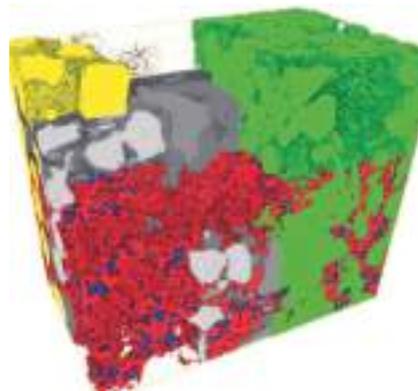
FIB SEM para Análisis 3D de alto rendimiento

Combina las imágenes y el rendimiento analítico de un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FE-SEM) con la capacidad de ablación de un haz de iones enfocado (FIB). Durante la ablación (Análisis 3D), benefíciense de su capacidad para obtener imágenes superficiales sobre muestras sensibles, obtenga imágenes de alta resolución con bajas energías de aceleración en muestras conductoras o sensibles al haz.



CROSSBEAM FIB

Incremente la eliminación de material hasta un 40% más rápido mediante la introducción de estrategias inteligentes de fresado FIB, prepare lotes de muestras, velocidad y precisión de las estrategias inteligentes de escaneo FIB para la eliminación de material.



CROSSBEAM 3D FIB-SEM

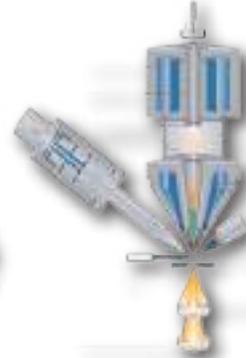
Realice análisis de EDS durante las tomografías con el módulo 3D Analytics integrado de Atlas 5. Obtenga imágenes de alto contraste utilizando el detector iens FsB con profundidad menor de 3nm (tamaño de voxel isotrópico) especialmente útil para muestras sensibles.



Más de ZEISS

CROSSBEAM

Sistema de Haz de Iones Focalizados - FIB



Crossbeam 340 COLUMN GEMINI I VP

Ofrece condiciones de análisis óptimas para experimentos in situ con compensación de cargas local e inyección de precursores para deposición y/o retiro de material.

Crossbeam 550 COLUMN GEMINI II

El sistema proporciona alta resolución, incluso con bajo voltaje gracias al BEAM BOOSTER, alta corriente gracias a la doble lente condensadora de la columna GEMINI 2 e independiente de la geometría de la muestra.

Zeiss Atlas 5 SOFTWARE

Software potente el cual crea una multiescala completa, imágenes multimodales con un correlativo centrado en la muestra ambiente, y adaptabilidad en SEM, y FIB-SEM.

ZEISS

Crossbeam 340 - 550

Nanotomografía - Nanofabricación



MN Technologies SAS representa para Colombia a Park Systems y toda su línea de microscopios de fuerza atómica AFM, incluyendo todos los modos de operación disponibles, además de proveer repuestos, instalación, capacitación y soporte post venta. Park Systems se esfuerza todos los días para estar a la altura del espíritu innovador de sus comienzos. A lo largo de nuestra larga historia, hemos cumplido nuestro compromiso de proporcionar los AFM más precisos y, a la vez, muy fáciles de usar, con funciones revolucionarias como el modo True Non-Contact™ y muchos programas automatizados.





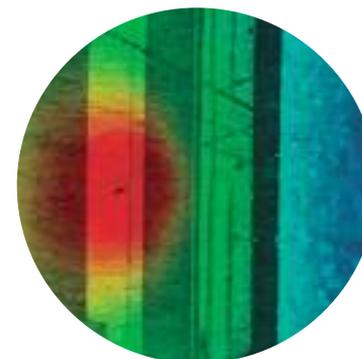
PARK SYSTEMS NX10 FUERZA ATÓMICA

Investigación Nanotecnológica Innovadora

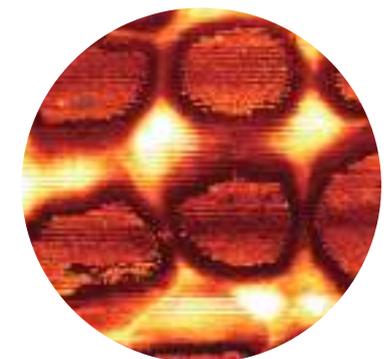


Park NX10 produce datos en los que puede confiar, replicables y publicables con la máxima resolución nanométrica. Presenta el inigualable modo True Non-Contact™, el cuál prolonga la vida útil de la punta y preserva su muestra al mismo tiempo, sus escáneres independientes basados en flexión para los ejes XY y Z proporcionan una incomparable resolución y precisión. La sencilla y fácil de usar interface, el sencillo alineamiento del láser, el enfoque automático de la punta, y software de procesamiento le permiten obtener rápidamente resultados publicables y un amplio rango de modos de medición y diseño personalizables.

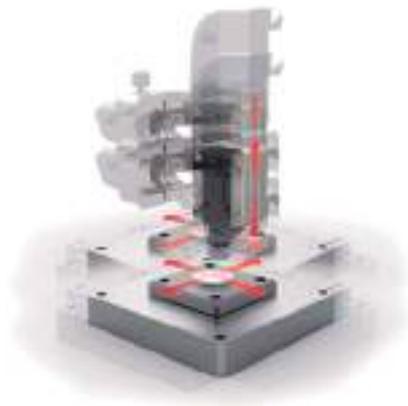
Datos en los que puede confiar, replicar y publicar a la resolución nano más alta. Cuenta con el único AFM sin contacto del mundo que prolonga la vida útil de la punta al tiempo que conserva su muestra, y escáner XY y Z independiente basado en flexiones para una precisión y resolución sin igual.



20 μm



20 μm



Más de PARK SYSTEMS

NX10 INVESTIGACIÓN

Otros productos con la tecnología Nano



PARK SYSTEMS

NX 10 El Camino más rápido a
La Investigación Innovadora

Park NX10 Microscópio Fuerza Atómica

Preciso escaneo XY gracias a la eliminación de interferencias, precisa una topografía de AFM con detector de bajo nivel de ruido Z, Mayor vida de la punta, mejor resolución y preservación de las muestras, solución AFM completa y extensible, y su ergonomía lo hace fácil de manejar para cualquier usuario.

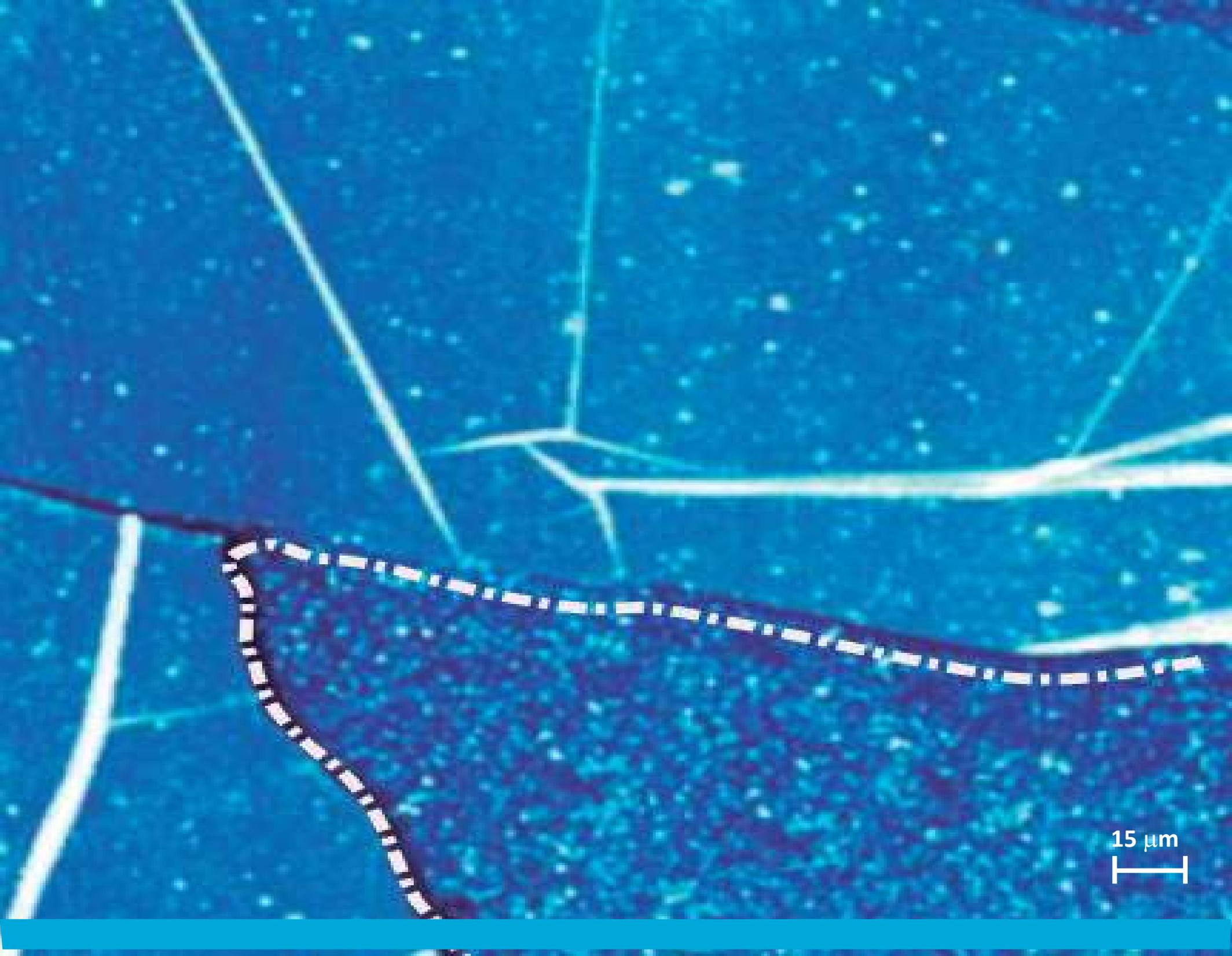
Park NX10 Caja Acústica 101

Los AFM miden las propiedades a escala nanométrica, por lo que cada pequeño factor puede tener un gran efecto en la precisión, aislando el instrumento del ruido y ayudando a Park AFM a ser el más preciso, fácil de manejar, y sólo pesa 40 kg.

Park NX10 Globe Box - Control Ambiental

Proporciona una atmósfera controlada para muestras que son sensibles al oxígeno y al vapor de agua. La atmósfera de la cámara se puede controlar cuidadosamente para determinar la humedad y la concentración de oxígeno.







PARK SYSTEMS

PARK NX7

Microscopio de Fuerza Atómica

Park NX7 proporciona una medición precisa de mayor resolución nanométrica que cualquier otro producto de su clase. Esto le permite obtener imágenes de la muestra y sus características medidas de manera fiel a su nanoestructura gracias a sus medidas de escaneo planas, ortogonales, y lineales, gracias a su arquitectura única de AFM: escáneres independientes en los ejes XY y Z basados en flexión. Además, el inigualable modo True Non-Contact™ de Park le proporciona las imágenes más nítidas, escaneo tras escaneo sin disminuir su resolución.



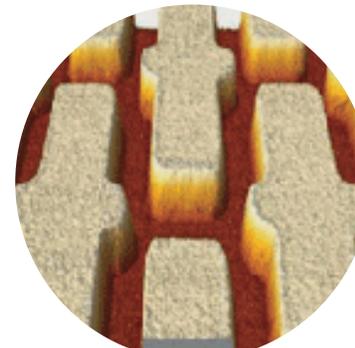
PARK FX40

Microscopio de Fuerza Atómica

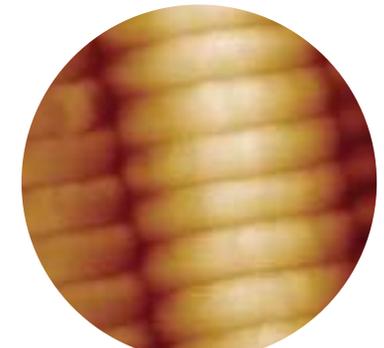
El Park FX40 transforma la microscopía de fuerza atómica, priorizando las ventajas para el usuario gracias a su innovadora autonomía y tecnología avanzada. La inteligencia y la robótica integradas automatizan las tareas de configuración y escaneo, liberando a los investigadores de las operaciones manuales.

TECNOLOGÍA NANO

La diferencia fundamental está en la arquitectura del escáner. El inigualable diseño con escáneres independientes basados en flexión XY y Z de Park sin arco de escáner, permite una precisión de datos de nano resolución sin precedentes en la industria.



15 μm



15 μm

Más de ZEISS

PARK NX7

Equipado con innovadora tecnología AFM

Escáner 2D Guiado
Flexión con Rango



PARK

Tecnología AFM
Fuerza Atómica
Nanoescala

El escáner XY consiste en pilas piezoeléctricas simétricas de alta fuerza de flexión bidimensional, que proporcionan alto movimiento ortogonal con un mínimo movimiento fuera de plano, así como una alta capacidad de respuesta, que es esencial para un preciso escaneo de las muestras en una escala nanométrica.



La intuitiva visión directa desde arriba en el eje de escaneo de la muestra le permite navegar fácilmente por la superficie de la muestra para encontrar el área objetivo. Una cámara digital de alta resolución con capacidad de zoom proporciona imágenes claras y de una gran calidad, independientemente del movimiento de paneo.

Óptica Directa
en el Eje





PARK SYSTEMS

PARK NX-HIVAC

Análisis de Fallas e Investigación de Materiales Sensibles



Park NX-Hivac permite el análisis de fallas mejorando la sensibilidad y la repetibilidad de las mediciones de AFM a través del entorno de alto vacío. Debido a que la medición de alto vacío ofrece mayor precisión, mejor repetibilidad y menos daño en la punta y la muestra que las condiciones ambientales o secas de N₂, se puede medir un amplio rango de respuesta de señal en varias aplicaciones de análisis de fallas, como concentración de dopante de Microscopía de Resistencia de Expansión por Barrido (SSRM). Permite la investigación científica de materiales que requieren mediciones de alta precisión y alta resolución en un entorno vacío libre de oxígeno y otros agentes.

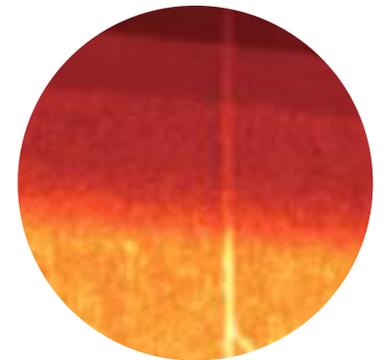
TECNOLOGÍA AUTOMÁTICA



La alineación del rayo láser motorizado permite continuar con rutinas de medición automáticas sin intervención. Con nuestro avanzado soporte voladizo prealineado, el rayo láser se enfoca en el voladizo al intercambiar la punta. La mancha láser se optimiza a lo largo de los ejes X e Y mediante perillas de posicionamiento motorizadas.



20 μm



25 μm

Más de ZEISS

PARK NX-HIVAC

Funciones Avanzadas de Automatización



PARK

Alto Vacío AFM

Materiales Sensibles a la Atmósfera

El alto vacío es controlado por Hivac Manger, bombeando para el vacío optimizado. Los procesos de condición y ventilación se controlan lógica y visualmente con un solo botón. Cada proceso se supervisa visualmente por color y cambios esquemáticos, no tendría que preocuparse por la secuencia de la operación de vacío. El software de control de vacío más rápido y sencillo le brinda facilidad en la operación y mejor productividad de uso en AFM.

Control de Vacío
AUTOMÁTICO





FEATURES

POWER TOME XL

POWER TOME PC

POWER TOME PCZ

POWER TOME 3D

FEATURES	<i>POWER TOME XL</i>	<i>POWER TOME PC</i>	<i>POWER TOME PCZ</i>	<i>POWER TOME 3D</i>
Controllers	Tactile only	Computer and tactile	Computer and tactile	Computer and tactile
Computer	No	Yes	Yes	Yes
Monitor	No	Touch screen	Touch screen	Touch screen
Section Counter	On tactile controller	On monitor & tactile controller	On monitor & tactile controller	On monitor & tactile controller
Advance Totalizer	On tactile controller	On monitor & tactile controller	On monitor & tactile controller	On monitor & tactile controller
Section Thickness	5nm to 10µm	0nm to 15µm	0nm to 15µm	0nm to 15µm
Total Advance	200µm	200µm	200µm	1000µm
Cutting Speed	0.0 - 99.9mm/sec	0.0 - 100mm/sec	0.0 - 100mm/sec	0.0 - 100mm/sec
Cutting Window	0.1 - 15mm	0.1 - 15mm	0.1 - 15mm	0.1 - 15mm
Cutting Window Display	LED Indicators	Visutrac™ display on monitor	Visutrac™ display on monitor	Visutrac™ display on monitor
Cutting Window Settings	On tactile controller	On monitor & tactile controller	On monitor & tactile controller	On monitor & tactile controller
Memory Channels	4	9	9	9
Automated Trim Function	No	Yes	Yes	Yes
Stereomicroscope	Accu-Scope 3075 binocular stereo microscope	Accu-Scope 3075 binocular stereo microscope	Accu-Scope 3075 trinocular stereo microscope	Accu-Scope 3075 trinocular stereo microscope
Camera	No	No	2.1 megapixel USB 3.1 color camera	2.1 megapixel USB 3.1 color camera

PowerTome XL

El PowerTome es el único ultramicrotomo totalmente ampliable, con la capacidad de tomar un PTLX, el caballo de batalla de rutina, y ampliarlo a un sistema de nivel de investigación PTPCZ con control por ordenador y opciones de vídeo HD, a un sistema de nivel de investigación PTPCZ con control por ordenador y opciones de vídeo HD.

El cliente tiene la opción de actualizar a un controlador basado en PC con o sin el paquete de vídeo de alta definición.



NUESTRAS CERTIFICACIONES

¿POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?

En MN Technologies valoramos la calidad y la eficiencia, por lo cual todos nuestros procesos y productos están aprobados por la normatividad colombiana.

Cada una de nuestras certificaciones nos ayudan a ser una mejor y más responsable empresa, cumpliendo con todos y cada uno de los estándares de calidad y servicio que nos certifiquen para poder proveer de la mejor manera.



Normativa APPCC
INDUSTRIA ALIMENTARIA



SOFTWARE
21 CRF II



IP65
GRADO DE PROTECCIÓN



NSF
INTERNACIONAL